光学像～SEM観察～分析まで効率化

Scanning Electron Microscope

JEOL

高分解能走査電子顕微鏡

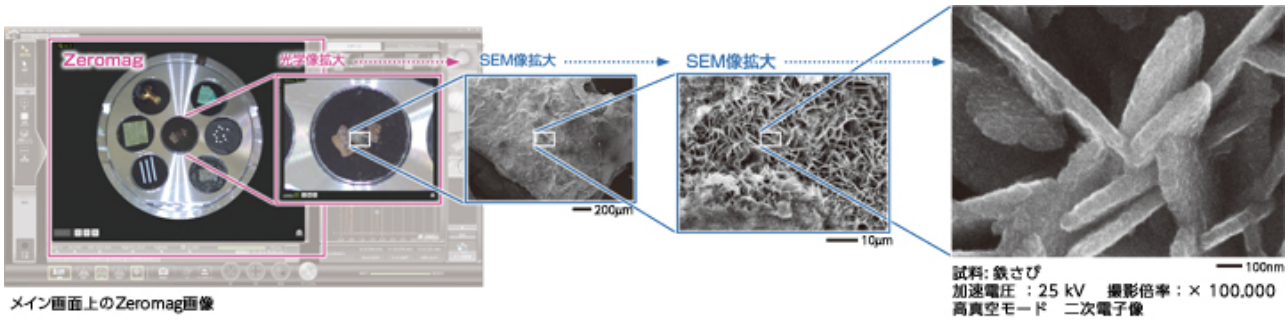
JSM-IT500HR

お困りではないですか？

- SEMは視野探しが大変
- 着目元素を観察中に知らせてくれたら
- 広視野のSEM像とEDS分析を手軽にやりたい
- ×100,000程度までをオートで簡単に観察したい
- サブμ分解能でEDS分析をしたい
- FE-SEMを導入するほど予算はないけどタングステンは能力不足

JSM-IT500HRで解決できます！

SEM視野探しの解決機能　Zeromag機能



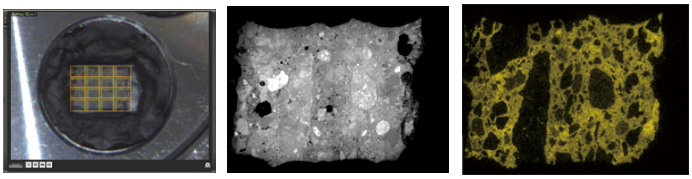
CCD光学像から拡大しSEM像に移行するので観察場所の視認性が格段に向上しました

着目元素を観察中に知らせてくれたら　LiveAnalysis機能

①着目元素はアラート表示でお知らせします

②観察している領域のEDS分析を常に観察画面表示

広視野のSEM像とEDS分析を手軽にやりたい　モンタージュ機能



反射電子組成像 Ca元素マップ
試料：コンクリート 加速電圧：15kV

CCD像から撮像エリアを決定し
フロー形式で観察条件を設定するだけで
自動で広視野撮影と分析を行います

【製造元】JEOL 日本電子株式会社

【代理店】株式会社菱光社